

## KLAIDŲ IŠTAISYMAS

**2018 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/1922, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejojop naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą, klaidų ištaisymas**

(Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 319, 2018 m. gruodžio 14 d.)

129 puslapis, 3B001.f. 3 ir 4 punktai: taisomas punktų išdėstymas.

- yra: „3. įranga, specialiai suprojektuota kaukėms, turinti visas šias charakteristikas:
- a. naudojami kreipiamąjį sufokusuotą elektronų pluoštą, jonų pluoštą ar „lazerio“ pluoštą ir
  - b. turinti bet kurią iš šių charakteristikų:
    1. spektrinio juostos pusplėčio (FWHM) dėmės matmenis, mažesnius nei 65  $\mu\text{m}$  ir vaizdo iškėlimą, mažesnę nei 17 nm (vidutinė vertė + 3 sigma), arba
    2. nenaudojama;
    3. mažesnę nei 23 nm (vidutinė vertė + 3 sigma) antrojo sluoksnio kaukės tapatinimo paklaidą;
    4. įranga, suprojektuota įtaisams apdoroti naudojant tiesioginio įrašymo metodus, turinti visas šias charakteristikas:
      - a. kreipiamąjį sufokusuotą elektronų pluoštą ir
      - b. turinti bet kurią iš šių charakteristikų:
        1. 15 nm arba mažesnę minimalų pluošto dydį arba
        2. mažesnę nei 27 nm (vidutinė vertė + 3 sigma) kaukės tapatinimo paklaidą;“
- turi būti: „3. įranga, specialiai suprojektuota kaukėms, turinti visas šias charakteristikas:
- a. naudojami kreipiamąjį sufokusuotą elektronų pluoštą, jonų pluoštą ar „lazerio“ pluoštą ir
  - b. turinti bet kurią iš šių charakteristikų:
    1. spektrinio juostos pusplėčio (FWHM) dėmės matmenis, mažesnius nei 65  $\mu\text{m}$  ir vaizdo iškėlimą, mažesnę nei 17 nm (vidutinė vertė + 3 sigma), arba
    2. nenaudojama;
    3. mažesnę nei 23 nm (vidutinė vertė + 3 sigma) antrojo sluoksnio kaukės tapatinimo paklaidą;
  4. įranga, suprojektuota įtaisams apdoroti naudojant tiesioginio įrašymo metodus, turinti visas šias charakteristikas:
    - a. kreipiamąjį sufokusuotą elektronų pluoštą ir
    - b. turinti bet kurią iš šių charakteristikų:
      1. 15 nm arba mažesnę minimalų pluošto dydį arba
      2. mažesnę nei 27 nm (vidutinė vertė + 3 sigma) kaukės tapatinimo paklaidą;“